ФИЗИКА

М. Л. КАЦ

УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ МОНОКРИСТАЛЛОВ КСІ И КВг, РЕНТГЕНИЗОВАННЫХ ПРИ НИЗ ОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ (Представлено академиком С. И. Вавиловым 23 VII 1947)

В 1939 г. автор и Соломонюк (1) показали, что измерение зависимости интенсивности люминесценции кристаллов NaCl, рентгенизованных пра темпер туре жидкого воздуха, от температуры при их последующем нагревании может служить новым, весьма удобным методом исследования энергетического спектра локальных уровней

энергии в кристалле. Электроны, поп. вшие во врепри МЯ рентгенизации низкой температуре на локальные уровни, "3aмораживаются" в **ЭТОМ** возбужденном состоянии до последующего нагревания красталла, в процессе кото, ого интенсивность люминесценции изменяется, обларуживая при определенных темперагурах резкие пики, происхождение которых обусловлено наличием локальных уровней различной глубины. Наши измерения были затем повторены в работе Дьяченко (²), уст. новившего также, что люминесценция рентгенизованного при низкой емлературе крищается при комнатной температуре, а содер кит



низкой ем тературе кри- рис 1. Изменение отношения интенсивности люмисталла NaCl не прекра- несценции к скорости изменения температуры в функшается при комнатной ции от температуры кристалла

еще несколько пиков, которые обнаруживаются в процессе нагревания крисгалла до 250° С. Плимененному нами способу следуют также Рендал и Уилкинс (³) в своих исследованиях спектров локальных уговней энергия щелочноземельных, цинковых и других фосфоров, опублакованных има в конце 1945 г.

Такой же способ был праменен автором пра исследовании видимой люманесценции красталлов КСІ и КВг, но для полученая полього спектра лэкальных уровней энергал в эгих красталлах необходимо исследовать температурную зависимость их люманесценцал т кже и в ультрафаолетовой часта спектра, что является целью данной работы.

Измерения проязведены пря помощи счетнака фотонов с платиновым сенсябилизяровалным фотокатодоя на тщательно очащенных от примесей монокристаллах КСІ и КВг, выращенных из расплава по методу Киропулоса. Рентгенизация красталла производилась при температуре жидкого воздуха технической рентгеновской трубкой с вольфрамовым антикатодом при 60 kV и 4 mA в течение 30 мин. При

нагревании рентгенизованного таким образом кристалла от температуры жидкого воздуха до комнатной температуры интенсивность люминесценции изменяется, обнаруживая при определенных температурах резкие максимумы (рис. 1).



Рис. 2. Спектры люминесценции КСІ и КВг



Рис. 3. Схема процессов поглощения и люминесценции кристаллов КСІ и КВг. А — верхняя зона заполненных уровней энергии, В — зона проводимости, F, I, L — локальные уровни энергии

В ультрафиолетовой люминесценции кристаллов КС1 наблюдается в исследованьом интервале температур один резкий спад интенсивности, который начинается при —155° С, и один максимум при —76° С. Повидимому, от температуры жидкого воздуха до начала наблюдения (—155° С) интенсивность люминесценции успевает пройти через максимум. В кривой изменения интенсивности ультрафиолетовой люминесценции кристалла КВг в функции от температуры, так же как и в случае КС1, наблюдается только спад первого минимума и два максимума при —76° С и —58° С.

Измерения спектров свечения КСІ и КВг, произведенные при помощи кварцевого монохроматора двойного разложения, показывают, что в области спектральной чувствительности счетчика фотонов с платиновым фотокатодом (2000—3200 Å) наблюдаемые полосы свечения КСІ и КВг имеют в исследованном интервале температур одинаковый спектральный состав, а именно: спектр свечения КСІ состоит из одной полосы с максимумом при $\lambda = 270$ mµ и спектр КВг также состоит из одной полосы с максимумом при $\lambda = 294$ mµ (рис. 2).

Приведенные в этой работе результаты, как и полученные ранее экспериментальные данные по люминесценции этих кристаллов в ультрафиолете и в видимой части спектра, могут быть объяснены следующей схемой процессов окрашивания и люминесценции кристаллов KCl и KBr (рис. 3). Через L_1 и L_2 отмечены локальные уровни, обусловленные дефектами кристаллической структуры, к каковым, кроме неоднородностей и внутренних микротрещин, следует отнести также ионы галоида, находящиеся в нерегулярных местах решетки, например в междоузлиях. Эти локальные уровни ответственны за длинноволновой спад в кривой собственного поглощения, простирающийся сравнительно далеко в длинноволновую часть спектра. Известно, что Гильшу и Полю (^b) удалось проследить влияние длинноволнового спада крив й собственного поглощения на образование F-центров вплоть до видимой части спектра. Известно также, что поглощение в длинноволновом спаде это — необходимое условие образования центров окраски, причем интенсивное образование F-центров не уменьшает поглощения в длинноволновом спаде, а, наоборот, коэффициент поглощения в этой части кривой возрастает (⁶).

В неокрашенных кристаллах локальные уровни L нормально заполнены электронами. При поглощении света из области максимума кривой собственного поглощения электрон переходит из верхней зоны заполненных уровней энергии А в зону проводимости В (переход а на рис. 3). Если поглощенный квант соответствует длинноволновому спаду кривой собственного поглощения, то электрон, забрасываемый в зону проводимости, срывается светом с одного из локальных уровней L (переход b на рис. 3). В том и в другом случаях поглощения положительная "дырка" локализуется на локальном уровне L, так как, возникнув в полосе А, она заполняется электроном из локального уровня L, вследствие чего полоса А остается заполненной, а "дырка" локализованной на локальном уровне. Попав в зону проводимости, электроны частично возвращаются в исходное состояние, частично застревают на локальных уровнях *l*, расположенных ниже зоны прово-димости на расстоянии 0,1—0,5 eV, и частично локализуются на локальных F-уровнях, расположенных ниже зоны проводимости на 2,19 eV (KCl) и 1,96 eV (KBr).

При тепловом высвобождении электронов из локальных уровней *l* наблюдается видимая люминесценция, обусловленная переходом электронов из зоны проводимости на локальные F-уровни. А так как локальные уровни *l* расположены на различной глубине, то интенсивность видимой люминесценции изменяется в функции от температуры и также обнаруживает при определенных температурах несколько разных максимумов. Таким образом, локализация положительной дырки и электрона (F-центр) проясходит в разных местах кристалла, и этим объясняется образование устойчивой окраски.

Участие локальных уровней L в процессах поглощения не учитывалось в предложенных ранее схемах уровней для щелочногалоидных кристаллов и поэтому образование устойчивой окраски по этим схемам было немыслимо. Вследствие диффузии положительных дырок в зоне А электроны на локальных F-уровнях должны были бы быстро с ними рекомбинировать, уничтожая окраску кристалла. Ультрафаолетовая люминесценция обусловлена в нашей схеме рекомбинацией электрона из F-уровня с положительной дыркой в зоне A, возникающей вследствие термического перехода электрона из зоны A на вакантное место на уровне L (переход с рис. 3). Вероятность заполнения вакантного места на локальном уровне L электроном из зоны A должна возрастать с повышением температуры по уравнению

$$\alpha = \alpha_0 e^{-W/kT}, \tag{1}$$

где W — разность энергии верхнего края зоны A и локального уровня L. k — постоянная Больцмана, T — абсолютная температура.

Появление максимумов в кравых измерения интенсивности ультрафиолетовой люминесценции КСІ и КВг объясняется наличием нескольких групп локальных уровней L, находящихся на различном расстоянии от зоны А. С возрастанием температуры сначала заполняются вакантные места локальных уровней L₁, р. сположенных ближе других к верхнему краю зоны А. Интенсивность люминесценции также возрастает, так как увеличивается вероятность перехода электронов на локальные уровни, что эквивалентно увеличению вероятности возникновения положительных дырок в зоне А. Интенсивность люминесценции, достигнув максимального значения, начинает затем падать вслед-

Таблица 1

Распределение локальных уровней энергии в окрашенных кристаллах КСІи КВг

Электронные переходы	сна кения энергии в eV	
	KCI	KDT
A→ B	7,6	6,58
	(по максимуму	
F -> B	0 10	Uщения) 1 06
Г → верхний край зо-	4,19	1,50
ны А	4, 57	4,2
$l_1 \rightarrow B$	0 089	6,12
$l_2 \rightarrow B$		0,19
$_{3} \leftrightarrow B$	0, 23	0,26
$\begin{array}{c} A \rightarrow L_1 \\ A \rightarrow L_2 \end{array}$? (<0,4) 0,40) ?(<0,38) 0.38
$A \rightarrow L_3$		0,46

ствие уменьшелия числа вахантных мест на уровнях L₁. Следующий подъем кривой обусловлен переходом электронов из зоны A на локальные уровни L₂, располо кенные выше уровней L₁.

Так как время пребывания положительной дырки в зоне А весьма м ло по сравнензю с продолжительностью жизна дырка на локальном уровне L, то интенсивность люминесценции определяется скоростью процесза термического з полненая вакантных мест н 1 L-уровнях электронами из зоны A, т. е. скоростью образования положительных дырок в зоне A. Поэтому

$$\frac{dn}{dt} = -an = -a_0 n e^{-W/kT}, \qquad (2)$$

где *n* — число дырок на локальных уговнях L данной глубины.

Рекомбинация электронов из локальных уровней l с положительными дырками, возникающими в зоне A, действует как тушение ультрафаолетовой люминесценции^{*}. Интегрируя (2), положив $n = n_0$ при t = 0, получаем

$$n = n_0 \exp\left(-\alpha_* \int_0^t e^{-W/kT} dt\right). \tag{3}$$

В условиях эксперимента температура кристалла изменялась по закону

$$T = A t^{\beta}, \tag{4}$$

где A и β постоянные, а t — время в секундах ($10 \le t \le 1000$). Поэтому (3) можно переписать в следующем виде:

$$n = n_0 \exp\left(-\frac{\alpha_0}{\beta A^{1/\beta}} \int_{T_0}^T e^{-W/kT} T^{\frac{(1-\beta)}{\beta}} dT\right) .$$
 (5)

Найдя отсюда интенсивность свечения и пользуясь методом вычисления, уже примененным автором (⁴), можно определить значения W для разлачных локальных уровней и таким обр зом получить их распределение по глубине по данным измененая интенсивности люминесценции в функции от температуры (табл. 1).

Саратовский государственный университет

Поступило 23 VII 1947

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

¹ М. Л. Кац и Р. Е. Соломонюк, ДАН, 24, 6°2 (1939). ² М. Н. Дьячен ко, ЖЭТФ, 10, 2×7 (1940). ³ J. T. Randall and М. Н. F. Wilkins Proc. Roy. Soc., A 184, 366 (1945). ⁴ М. Л. Кац, ДАН, 58, № 8 (1948). ⁵ R. Hilsch u. R. W. Pohl, Z. f. Phys., 68, 721 (1931). ⁶ E. Rexer, Phys. Z., 36, 602 (1935).

^{*} Если эти переходы также сопровождаются свечением, то, как можно ожидать, оно должно быть за пределами прозрачности кварцевой трубки счетчика